<u>伊藤 仁彦</u>^a, 久保 佳実^a, 与儀 千尋^b, 太田 俊明^b Kimihiko Ito^a, Yoshimi Kubo^a, Chihiro Yogi^b, Toshiaki Ohta^b

^a物質・材料研究機構,^b立命館大学 SR センター ^aNational Institute of Material Science, ^bThe SR Center, Ritsumeikan University

次世代リチウムイオン電池用として Li と Si の合金負極が検討されている。市販の SiO 粒子に Li を充電した後、Li や O の状態分析を試みた。その結果、Li K-edge のスペクトルから Li の状態は炭酸化物もしくは酸化物に見え、主として被膜の情報を検知していることがわかった。一方 O K-edge からは SiO₂内部と被膜の両方の情報が重なって検知できている可能性があることがわかった。

Li K-edge and O K-edge XANES were measured for Li charged SiOx anode. We found that physical information of SEI was mainly obtained from Li K-edge spectra, on the other hand, information both of SEI and SiO_2 matrix from O K-edge spectra.

Keywords: Si, anode, Li K-XANES, O K-XANES

<u>背景と研究目的</u>: 次世代リチウムイオン電 池用として、Li合金系の負極の研究開発が進 められている。特にLi-Si系はその単位重量あ たりのエネルギー密度が高いため注目されて いる。これまでに主として充放電に伴う構想 変化をX線回折法で評価した報告がなされて いるが¹⁾、負極反応を十分に理解するために は、LiやSiをはじめ電極内に含まれるCやO の荷電状態を調べることが必要になった。X 線吸収スペクトルから荷電状態、あるいは化 学状態を調べることはX線光電子分光にない 利点があり、この手法を活用することにより 各元素の状態分析を試みた。

実験: 市販のSiOxに電気化学的にLiを入れ た(充電した)後、電気化学セルから取り出 した状態の試料、およびリファレンス試料と してLi₄SiO₄粉、表面が雰囲気中の残留水分や 二酸化炭素によって炭酸化したLi金属箔を比 較として用いた。SiOx粒はマトリックスが SiO₂でナノサイズのSi結晶が含まれる構造を しており、酸素が多量に含まれる。Li侵入に より酸素の状態も変化する可能性があること から、OK-edgeの吸収スペクトルも測定した。 試料はすべて、物質材料研究機構内のグロ ーブボックス (露点-70℃以下で管理) 内でカ ーボンテープに固定した後、立命館大学SRセ ンターから貸与されたトランスファーベッセ ルに乾燥Arにて封じ、大気暴露させることな く立命館大学SRセンター BL-2まで移送した。 BL-2にて、主な構成成分であるLi およびOの K吸収端XANES測定をおこなった。測定モー ドは全電子収量(TEY)、部分電子収量(PEY) および蛍光収率(FY)の3モードについて行 ったが、本報告ではTEYとPEYの結果につい て報告する。

結果、および、考察: Li充電後のSiOx 試料、のLi K-edgeの線吸収スペクトルをFig.1 に示す。黒線で示したFYと赤線で示したTEY で大きな違いが確認された。Fig. 1 の電極表 面からみたLiの状態は、ここに示していない が、表面はLi₂CO₃もしくはLi₂Oに近く、FYは LiFに近い形状をしている。Fは溶質に含まれ ており、結果を説明しうる可能性がある。

Fig.2 はリファレンスとして測定した Li₄SiO₄、表面炭水化物となっている Li 金属 箔の Li K-edge の吸収スペクトルである。両 試料とも FY と TEY で大きな違いが確認され た。表面炭酸化した Li の TEY はまさに炭酸 化物で、Fig.1 の TEY と似ており、一方 FY はここに示していないが Li₂O に類似してい る。Li 金属の表面被膜は再表面に疎な炭酸化 物、その下に比較的密な Li2O があるという報 告があり²⁾、そのモデルと符合している。Fig.1 に示したスペクトルと Li₄SiO₄ や表面炭酸化 した Li とはスペクトル形状は全く異なり、 SiO₂換算で深さ100nm程度までに信号発生源 が空間的に限定されているため、主として被 膜表面の状態だけを反映していると考えられ る。

O K-edge のスペクトルを Fig. 3 に示した。 Fig.4 は Fig.2 にと同じ参照試料の O K-edge の 吸収スペクトルである。O の状態でみると Fig.3 のスペクトルは、Fig.4 の比較から Li₄SiO₄ と炭水化物となった表面炭酸化した Li 金属とが重なったような構造となってい る。光子のエネルギーが Li K-edge の 10 倍で ある 500eV であることを考えると、特に蛍光 では SiO₂に対して 1µm くらいの深さまで検 知できているはずで、酸素からの信号発生源 は、被膜の Li 炭水化物等と Li が侵入した SiO₂ マトリックスからであると考えられる。FY と TEY がよい一致を示しているが、この原因 についてはさらなる検討を要す。

以上のように、特に Li K-edge 付近まで低 エネルギーの光を用いる場合はいくら XAS といえ表面敏感となることに注意が必要であ ることがわかった。逆にここで得られた知見 を利用すれば、電極を表面に平行に加工しな がら逐次的に Li および O の状態分析を実施 することにより、電極膜内部の特に深さ方向 の状態を詳しく解析できると期待される。現 在、その加工と分析を大気非暴露で一貫して 実施できるような準備を遂行中であり、今後、 Li-Si 合金化過程の基礎研究につなげてゆき たいと考えている。

<u>文</u>献

 M. N. Obrovac and L. Christensen, *Electrochem. Solid-State Lett.*, **7**, A93 (2004).
K. Kanamura, H. Takezawa, S. Shiraishi, and Z. Tekehara, *J. Electrochem. Soc.* **144**, 1990 (1997).

<u>論文・学会等発表(予定)</u> 未定



Fig. 1. Observed Li K-edge XANES spectra of SiOx anode after first Li charging



Fig. 2. Observed Li K-edge XANES Spectra of Li silicate and surface- carbonated Li foil



Fig. 3. Observed O K-edge XANES spectra of SiOx anode after first Li charging



Fig. 4. Observed Li K-edge XANES Spectra of Li silicate and surface- carbonated Li foil